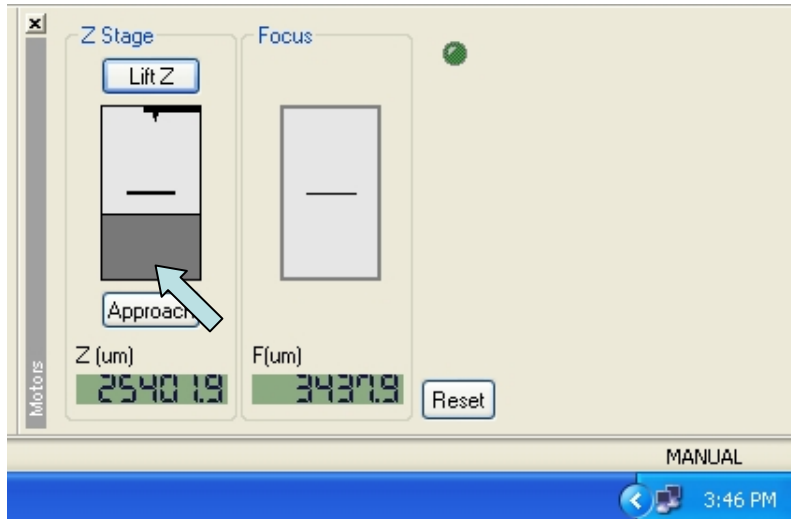


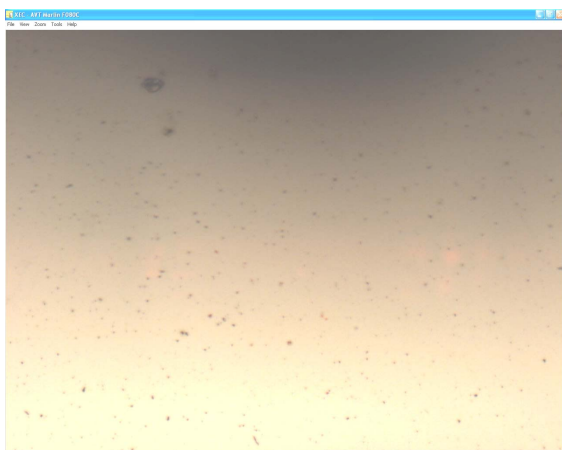
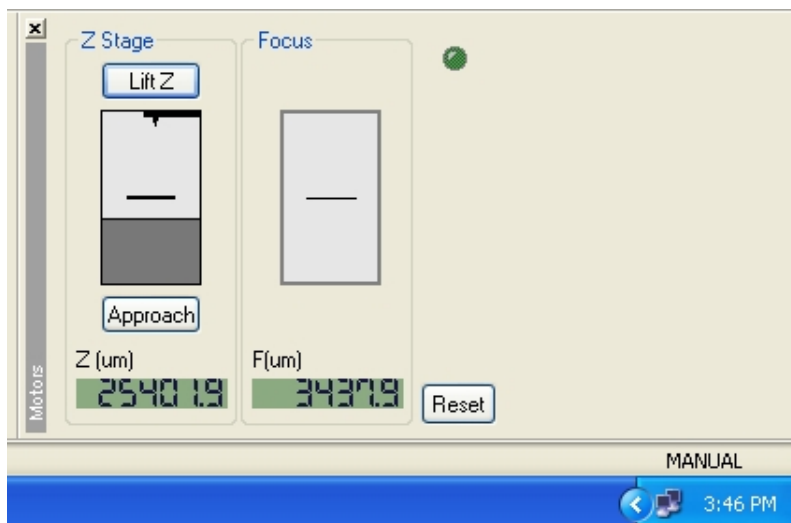
XE120 Tip Approach SOP

by 朱華偉 Sep,2005

1. 目視下，降低探針高度（Z-stage）使其接近 sample 表面（小心不可碰觸到 Sample）；



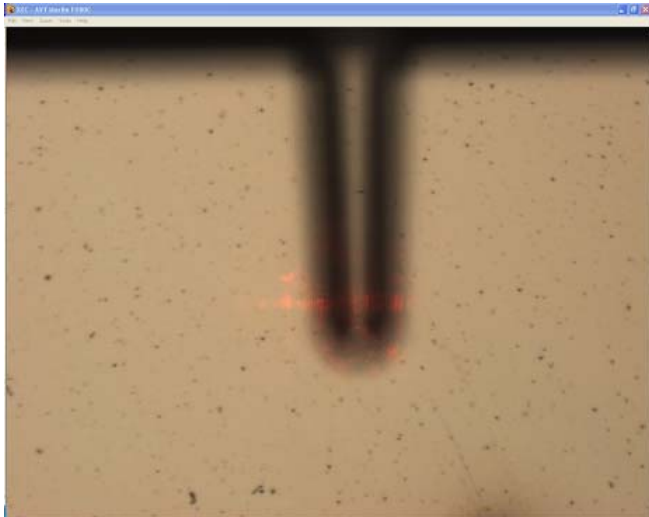
2. 向下調整 CCD 物鏡焦距(Focus)使其清楚成像於 Sample 表面;移動 Sample 手動 XY Stage 選擇 Sample 表面較乾淨之區域，以利後續下針；



3. 向上調整 CCD 物鏡焦距 (Focus) 使其清楚成像於 Tip 表面, 再適度調降約 100 μm ;



4. 調降探針高度 (Z-stage) 直至 Sample 表面清晰可見, 此時 Tip 與 Sample 表面距離約為 100 μm (小心不可以過度降低 Z-stage 以免撞針);



5. 按下按鈕 Approach 進行自動下針功能, 直至探針進入原子力作用範圍。

